

PSS LDBI3072-TO56-P

LD 集成式老化系统 ▶▶▶



产品简介

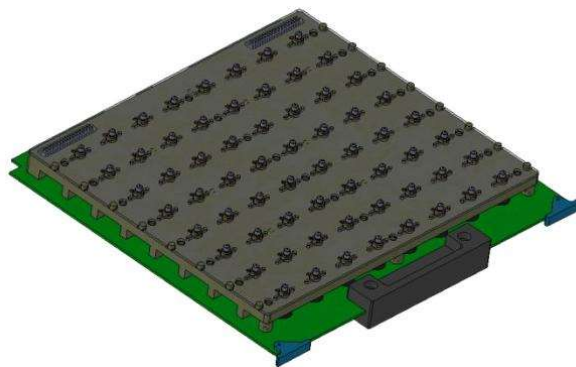
普赛斯 LD 集成式老化设备,用于小功率可见光 LD TO 器件的老化筛选以及可靠性寿命分析,筛选后有效提高 TO 产品的质量。系统可支持 3072 路器件的老化,通过给 LD 器件提供恒定电流来实现对器件的老化,系统可实时显示老化电流、正向电压、背光电流、温度、功率等参数并且图形直观显示,便于用于观察老化过程中的异常情况,通用老化板兼容我司其他自动化设备。

产品应用

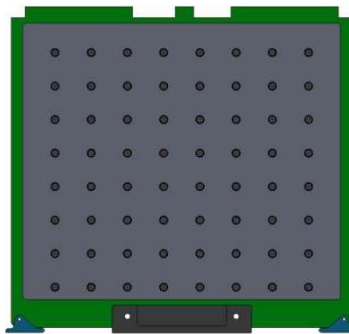
- 可用于批量生产环节中可见光 LD TO 器件进行老化筛选
- 长时间可靠性失效测试分析

产品特点

- 提供每块老化板完全独立的驱动电流
- 集成式老化箱自带两个独立箱体，可完全独立控制，升温速度效率高，无过冲；支持过温保护
- ACC 恒流模式和 APC 恒背光模式可选
- 老化板作为通用载体，可以实现盘测、老化不同工位直接的转料，提高生产效率；每个 TO56 插槽旁边安装一个 NTC 热敏电阻，可实时检测温度



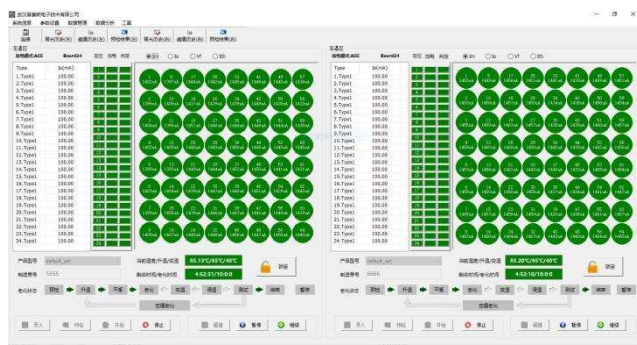
- 每一块老化板都可配置安装前光检测板，实时监控老化前光功率，并定时测试 LIV 特性



- 支持热插拔，可靠的 ESD/EOS 防护，保证器件老化期间的安全，支持开路和短路保护



- 支持扫描 LIV 计算 Ith



上位机软件



Ith 重复性 (典型测试)

- 软件切换支持各种类型封装 LD 器件的老化，支持 TO56 固定 3 脚位切换

技术参数

参数	指标
激光器封装类型	TO56, 支持 TO56 固定 3 脚位切换
系统规模	3072 路, 2 个独立温区
LD 驱动电流	0-150mA, $\pm 0.5\%rdg \pm 2mA$
LD 电压范围	0~7V
LD 电压测量	0~7V, $\pm 0.5\%rdg \pm 40mV$
背光电流检测	0-2000uA, $\pm 0.5\%rdg \pm 10uA$
温度检测	25~120°C, $\pm 1^\circ C @ 60^\circ C$, 10KNTC
前光功率检测	10~100mW, $\pm 0.5\%rdg \pm 0.5mW$
响应波长	380-900 nm
温度范围 (仓内温度)	45~90°C
管壳温度测试范围	65°C~100°C
温控特性	温度均匀性: $\pm 2^\circ C$ (无负荷), 温度稳定性: $\pm 0.5^\circ C$ 升温速度: 2°C/Min, 降温速度: 1°C/Min
电源输入	三相五线 AC 380V/50HZ
尺寸 (宽 x 高 x 深)	1400 x 1800 x 1200(mm)